

## Anwendungsbereich

Anwendungsbereich dieser Norm ist ...

### Inhalt

	Seite
Nationales Vorwort.....	3
1 Anwendungsbereich.....	5
2 Normative Verweisungen .....	6
3 Begriffe .....	6
4 Prüfverfahren.....	6
4.1 Prüfbedingungen .....	6
4.2 Prüfschirmdurchmesser.....	7
4.3 Anzuwendender Frequenzbereich .....	7
5 Prüfmittel .....	7
6 Vorbereitung der Prüflinge .....	8
6.1 Rundsteckverbinder.....	8
6.2 Rechtecksteckverbinder .....	9
6.3 Steckverbinder für Leiterplatten .....	9
6.4 Impedanzanpassung zwischen Empfänger- und Erregerkreis.....	10
6.5 Vorbereitung des Empfängerkreises .....	10
6.6 Anpassung des Erregerkreises .....	10
6.7 Kalibrierung der Prüfanordnung .....	10
7 Messung der Schirmwirkung .....	11
7.1 Messung .....	11
7.2 Berechnungsverfahren für die Schirmwirkung <i>SE</i> (Dämpfung) anhand der Oberflächen- Transferimpedanz <i>Z<sub>T</sub></i> .....	11
8 Anforderungen.....	12
9 Festzulegende Einzelheiten .....	12
<b>Bilder</b>	
Bild 1 – Messprinzip Paralleldrahtverfahren .....	6
Bild 2 – Einrichtung des Prüfaufbaus.....	8
Bild 3 – Beispiel für Prüfaufbau mit Rundsteckverbindern .....	9
Bild 4 – Beispiel für Prüfaufbau mit Rechtecksteckverbindern.....	9
Bild 5 – Beispiel für einen Prüfaufbau mit geschirmtem Steckverbinder für Leiterplatten.....	10
Bild 6 – Aufbau für die Kalibrierung .....	11
Bild 7 – Beispiel eines Ausdrucks der Schirmdämpfung (Schirmwirkung).....	12
<b>Tabellen</b>	
Tabelle 1 – Bedingungen für die Transferimpedanz des Prüfschirms.....	7